

NAIST-IS-MT1551112

修士論文

高信頼性ソフトウェア検証における不具合の分類結果に
基づいた単体テストケース自動生成の適用及び改善

山崎 雅也

2017 年 2 月 2 日

奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科 情報科学専攻

本論文は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科に
修士(工学) 授与の要件として提出した修士論文である。

山崎 雅也

審査委員：

飯田 元 教授	(主指導教員)
松本 健一 教授	(副指導教員)
片平 眞史 教授	(副指導教員)
石濱 直樹 准教授	(副指導教員)
川口 真司 准教授	(副指導教員)

高信頼性ソフトウェア検証における不具合の分類結果に基づいた単体テストケース自動生成の適用及び改善*

山崎 雅也

内容梗概

宇宙機ソフトウェアと呼ばれる人工衛星等に搭載されるソフトウェアは、宇宙空間で使用するという特性上大きな修正を加えることができないため、非常に高信頼かつ安全であることが求められる。このような高信頼性や安全性を実現するために全てのソフトウェア開発プロセスにおいて様々な検証が行われるが、ソフトウェアより不具合を完全になくすことは現実的な時間では難しい。このことより、過去の開発過程で発生したソフトウェア不具合を分析することは、運用や未来の開発に対して、より高信頼かつ安全なものにするために有効な手段である。

本研究では、過去の宇宙機ソフトウェア開発の不具合を定性的及び定量的に評価し、高信頼ソフトウェアの開発が抱える問題を明らかにし、ソフトウェアが抱えるリスクを早期に低減する一手法を明確にする。はじめに7つの宇宙機プロジェクト計50個の不具合に対して直行欠陥分類法の適用を試みた。その過程で宇宙機ソフトウェア開発に適した直行欠陥分類法を提案した。また分類されたそれぞれの属性に対して因果分析を行い、問題を洗い出した。改良した直行欠陥分類法での分類と因果分析を行ったところ、全体の不具合のうち28%が設計で混入した不具合がシステムテストで見つかることがわかった。また、割り込み等のタイミングの問題は様々な検証の観点で見つかることなどが分かった。この問題を解決すべく、単体テストケースの自動生成技術である **Concolic Test** の適用を行うことで解決を試みた。結果としていくつかの条件文でテストケースを生成できない場合が存在し、その中でも最も多く存在した配列の要素数が定数でない場合に対して、最適化コンパイラ

* 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報科学専攻 修士論文, NAIST-IS-MT1551112, 2017年2月2日.

で用いられることが多いループ展開を応用した。これによって、テストケース生成ができることを確認した。

キーワード

宇宙機ソフトウェア, 直交欠陥分類法, ソフトウェアテスト, 自動単体テストケース生成, Concolic Test

*

Masaya Yamazaki

Abstract

Abstract

Keywords:

Spacecraft Software, Orthogonal Defect Classification, Software Test, Automated Unit Test Case Generation, Concolic Test

* Master's Thesis, Department of Information Science, Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, NAIST-IS-MT1551112, February 2, 2017.

目次

1.	はじめに	1
2.	関連技術・関連研究	3
2.1.	不具合分析の関連技術	3
2.2.	不具合分析の関連研究	4
2.3.	テストケース自動生成の関連技術	7
2.4.	テストケース自動生成の関連研究	9
3.	提案分類方法	11
3.1.	分析目的	11
3.2.	予備実験	11
3.3.	分類	12
4.	分類結果	14
4.1.	Insertion Activity	14
4.2.	Detection Activity	15
4.2.1.	Supplier Testing	16
4.3.	Effect	17
4.4.	Trigger	18
4.5.	Type	22
4.6.	Mode	25
4.7.	考察及び課題	27
5.	提案手法	28
5.1.	Concolic Testing の宇宙機ソフトウェアへの適用	28
5.1.1.	対象宇宙機ソフトウェア	29
5.1.2.	適用結果	30
5.1.3.	考察及び解決策	31
5.2.	ループ展開	32

6.	評価実験	33
6.1.	実験目的と内容	34
6.2.	評価結果	35
6.3.	考察	36
7.	おわりに	37
	謝辞	38
	参考文献	39

図目次

1	Insertion Activity の分布	14
2	Detection Activity の分布	15
3	Supplier Testing の分布	16
4	Effect の分布	17
5	Trigger の分布	18
6	Trigger-Effect の分布	21
7	Type の分布	22
8	Type-Supplier Testing の分布	24
9	Mode の分布	25
10	Mode-Trigger の分布	26

表目次

1	Lutz らの運用上の不具合分類の属性 (文献 [20] より引用)	5
2	Lutz らの運用上の不具合分類の要素 (文献 [20] より引用)	6
3	Concolic Test ツールの一覧 (文献 [33] より引用)	8
4	テスト改善のための欠陥分類の属性	12
5	テスト改善のための欠陥分類の要素	13
6	Trigger の定義	19
7	Trigger の実例	20
8	Trigger-Type の分布	23
9	Concolic Testing 適用結果	30

1. はじめに

現在、世界中で宇宙開発が盛んにおこなわれている。日本も例外ではなく、人工衛星をはじめとする様々な宇宙開発プロジェクトが行われている。しかしながら、Ariane 5 [18] や Mars Climate Orbiter [7] に代表されるようにソフトウェアの些細な不具合、複合的なエラーや開発者の想定不足によって引き起こされる不具合によってミッションが失敗となる事が多々ある。原因として、レガシーシステムの再利用に伴うリグレッションテストの不足や、ソフトウェア開発プロセスの問題などが挙げられる。そういった不具合をなくすためソフトウェアを開発する組織から技術面、組織面、及び資金面で独立している組織が実施する IV&V (Independent Verification and Validation) [16] などの様々な取り組みがなされている。一方でこれらは人に頼った検証が多くを占め、システム間の不整合、工数増大、品質のエンジニア依存、ノウハウの継承の問題など様々な問題を抱えている。Brian らの Mars Climate Orbiter のミッション失敗の要因の検証によると、これらの問題を解決するためには一定の水準を保ちながら、できることはソフトウェアによって検証を行うことが1つの解決案であると報告されている [7]。

本研究では宇宙機ソフトウェア開発で蓄積された開発に関する不具合情報を基にソフトウェアテストのあり方を明らかにすることを目指す。不具合分類の手法として Ram Chillarege らによって開発された直交欠陥分類法 [27] がある。直交欠陥分類法は定性的分析 (e.g. HAZOP) と定量的分析 (e.g. FTA) の両方の性質を併せ持つ技法であり、欠陥の性質及びその量から傾向を分類し、ソフトウェア全体の問題を洗い出すことができる。また、開発プロセスや特定の技術に依存することがなく、幅広い分野で用いられている。しかしながら、宇宙機における特殊な開発プロセスや性質をより明確に明らかにし、有効なテスト手法を確立するために宇宙機ソフトウェアに特化した欠陥分類法を提案する。また、実際に5つの宇宙機プロジェクト計50個の不具合について分類を行った。またその結果に対して Deep Dive [8] と呼ばれる手法を用い、不具合の根本的原因や傾向を導き出し、適切なテスト手法を明確にすることを本研究の目的とする。

以降、2 章では関連技術及び関連研究を紹介する。3 章では本研究の目的及び分類手法について述べる。4 章では分類及び分析結果を記載する。5 章では **Concolic Test** を実際に適用した結果を述べる。6 章では提案手法の実験及び検証結果を示す。7 章では本研究のまとめと今後の課題について述べる。

2. 関連技術・関連研究

本章では、関連技術とそれらについて調査を行った既存研究を紹介する。

2.1. 不具合分析の関連技術

不具合分析には大きく分けて、統計的手法と原因解析が存在する。統計的手法ではその不具合の数のみを不具合分析の要素とするため定量的分析手法である。具体的な例としては FTA(Fault Tree Analysis) の定量的分析などがある。一方で原因解析は、1 つの不具合について原因や結果などを用いて詳細に分析するため、定性的分析手法である。具体的な例として、HAZOP(Hazards and Operability Analysis) などがある。一般的にソフトウェア開発プロセス全体の見直しをする場合には統計的手法が用いられ、ソフトウェア開発の大きな不具合が発生した時には原因解析が行われる [15]。この 2 つの問題点として、両方の性質を同時に扱うことは非常に手間がかかることがある。

直交欠陥分類法 (ODC: Orthogonal Defect Classification) は IBM の Ram Chillarege らによって開発されたソフトウェアのための欠陥分類法である [27]。観点の異なる属性から構成されていることから直交と呼ばれる。また、定性的分析と定量的分析の両方の性質を併せ持つことから、欠陥の数と性質から改善方法を考えることができる。まず、欠陥報告時と欠陥修正時に大きく分類され、その後より小さな分類である属性 (e.g. Trigger, Activity, Target 等) に分類される。属性のうち、欠陥報告書に含まれる情報で活用できるものを選択し、実際に不具合分類を行う。現在は version 5.2 [11] がリリースされており、これはソースコードおよび設計に焦点を絞ったものである。大きくオープナーセクションとクローザーセクションに分かれており、これらは欠陥発見時と欠陥修正時という意味がある。またそれぞれに属性が存在し、合計 8 つの属性からなる。属性のうち欠陥報告書に含まれる情報を活用できるものを選択し、実際に不具合分類を行う。また、同様の規格として IEEE が提唱している IEEE 1044-2009 がある [30]。これは IEEE Standard Association によって定められた不具合分類法に関する規格である。属性が ODC に比べても多いことが特徴である。

2.2. 不具合分析の関連研究

Lutz らは宇宙機ソフトウェアの不具合分析結果より、要求の問題をソフトウェアテストから発見する方法や、運用の不具合を明確化している [19, 20]。テストは通常要求が満たされているかを確認するための手順であるが、ソフトウェアの欠陥以外の要求等の問題が抽出できるということが明らかになっている。また、運用中のソフトウェアの不具合を解析することによって、ソフトウェアの操作文書と通信の問題など運用特有の問題が存在していることや、通常行わない以上回復などの操作は不具合の要因になりやすいことを明らかにしている。表 1 及び表 2 に Lutz らの運用上の不具合分析の属性と要素を示す。以上の 2 つの事例に関しては両方とも直交欠陥分類法と呼ばれるものを利用している。しかしながらどちらもソフトウェアテストを改善するための分類方法ではなく本研究に当てはめることはできない。また、どちらも直交欠陥分類法自体はそのまま使っており、属性の中の要素の変更のみである。このことより、宇宙機ソフトウェアのテスト手法を検討するためには改善が必要である。

Gortte らは宇宙機ソフトウェアにおける不具合を「小さいバグ」という単位で分析している [23]。彼らの分析では、ソフトウェアのバグを”Bohrbugs”, “Mandelbugs”, “aging-related bugs” に分類し、ミッションごとの特徴を明らかにしている。しかしながら、改善策としてはモデル検査によるコードの質の改善やレジリエントにする方法しか示されておらず、ソフトウェア開発プロセス全体の問題にはフォーカス出来ていない。

Huang らは ODC の自動化のツールを公開している [17]。これは機械学習を基に分類を行うものだが、今回は学習データが少ないので利用できない。

宇宙機ソフトウェア以外を対象に直交欠陥分類法を変化させた例として、Freimut らの BOSCH 社でのガソリンエンジンシステムを例として欠陥を抽出した研究がある [6]。彼らの研究では、実際に開発している社員に対してインタビューを適正に行い、ある分野に特化した欠陥分類法へと変化させてさせることにより精度の高いものにすることにできることを示している。このことより、直交欠陥分類法は改良を加えることにより、より適切に分析することが可能になることが示されている。

表 1: Lutz らの運用上の不具合分類の属性 (文献 [20] より引用)

タイミング	属性	意味
欠陥報告時	Activity	どこの運用で発見したか
	Trigger	どのような状況で発生したか
欠陥修正時	Target	不具合存在箇所
	Type	何を間違ったのか

表 2: Lutz らの運用上の不具合分類の要素 (文献 [20] より引用)

Activity	Trigger	Target	Type
System Test Flight Operations Unknown	Software Configuration	Ground Software	Function/Algorithm
	Hardware Configuration	Flight Software	Interfaces
	Start/Restart, Shutdown	Build/Package	Assignment/Initialization
	Command Sequence Test	Ground Resource	Timing
	Inspection/Review	Information Development	Flight Rule
	Recovery	Hardware	Install Dependency
	Nomal Activity	None/Unknown	Packaging Scripts
	Special Procedure		Resource Conflict
	Hardware Failure		Documentation
	Unknown		Procedures
			Hardware
			Nothing Fixed
			Unknown

2.3. テストケース自動生成の関連技術

テストケース自動生成技術はシステムテスト、統合テスト、単体テストの各フェーズにて存在する [10]。

本章では研究対象である単体テストケース生成自動生成を中心に述べる。

Concolic Testing [1] とは Koushik らによって提唱された SMT ソルバを用いた形式手法によるテストケース生成とランダムテストを合わせて現実的な時間で動的に単体テストケース生成を行う手法である。Concolic とは Concrete と Symbolic を合わせた造語であり、形式手法を用いながらも動的な探索も行うことを意味する。SMT ソルバは不定要素を含む論理式があるときに、その不定要素に対して、適切な値を割り当てることで、対象論理式全体を成立できるようにできるかという充足可能性判定問題と呼ばれるものを解くのに用いられるものである [34]。プログラムを論理式に変換することによって単体テストケース自動生成を実現している。Concolic Test を実行するツールは様々存在し、Xiao らによってまとめられている [33]。また、現状の限界として (1)float, double 型が扱えないこと、(2) ポインタ扱えないこと、(3) ネイティブコールが使えないこと、(4) 非線形演算ができないこと、(5) ビット演算ができないこと、(6) 配列のオフセットが扱えないこと、(7) ファンクションポインタが使えないこと、が挙げられる。なお (1) に関しては、Softfloat というシミュレーションソフトウェアを用いることで回避できることが示されている [26]。また、(4) に関しては SMT ソルバとして Yices の代わりに Z3 を用いることによって解決されている [2]。

表 3: Concolic Test ツールの一覧 (文献 [33] より引用)

Tool	Language	Platform	Oracle	Constraint Solver
DART	C	NA	UE	lp_solver
SMART	C	NA	UE	lp_solve r
CUTE	C	Linux	UE	lp_solver
jCUTE	Java	Linux	UE	
CREST	C	Linux	UE	Yices
EXE	C	Linux	UE	STP
KLEE	C	Linux	UE	STP
Rwset	C	Linux	UE	STP
JSFuzz	Java	Linux	UE	built on JPF
PathCrawler	C	NA	NA	NA
Pex	.NET	Windows	UE	Z3
SAGE	machine code	Windows	UE	Dislover
NA	PHP	NA	NA	NA
Apollo	PHP	NA	NA	NA

2.4. テストケース自動生成の関連研究

自動テストケース生成の研究としては遺伝的アルゴリズム、山登り法、焼きなまし法などのサーチ技法を用いた **Search-based Testing** を用いた研究がある [22]。これらは網羅的にソフトウェアを検証するよりも、特定の目的に対して適合関数を設定し、それを解決するアルゴリズムを提供するものである。したがって、解決すべき適合関数が明白である場合には有効なテストケース自動生成を行える。

網羅的にソフトウェアを検証できているかの基準としてコードカバレッジがある。具体的な基準として命令網羅 (C0)、分岐網羅 (C1)、条件網羅 (C2) などが存在する [9]。しかしながら、最もテストケース数が多くなる条件網羅は条件文 n が存在した場合に、そのテストケース数は n^2 となり、全ての機能に対してテストケースを作成することは難しい。そこで、航空機ソフトウェアをテストするカバレッジの基準として、RTCA によって策定された DO-178B に記述されている MC/DC(Modified Condition/Decision Coverage) がある [13]。この基準を用いると条件文 n が存在した場合に、そのテストケース数は $n + 1$ となり C2 に比べてテストケース数を削減することができ、実用的な基準となっている。

網羅的にソフトウェアを検証するためのテストケース自動生成を行う研究としては 2.3 章で述べた、記号実行を具体的な値をテストケースとして生成しながら動的にテストを行う、**Concolic Testing** がある。Sagharatna らは組み込み分野で用いられることが多い、Matlab/Simulink によって生成された簡単な C コードに対して MC/DC を満たすテストケースを生成することができることを実証するとともに [28]、循環的複雑度が高くなるほど、MC/DC が低くなることを明らかにしている [29]。また、**Concolic Testing** を実用ソフトウェアに対して適用した研究として Moonzoo らの Sumsung の Linux プラットフォームやセキュリティライブラリに適用した研究 [24] や Braione らの原子力プラントのマニピレータの制御ソフトウェアに適用した研究がある [26]。

宇宙機ソフトウェアに対するテストケース自動生成を試みた研究としては Shankar らの SILS(Software in Loop Simulation) と呼ばれる制御システム全体をソフトウェアでシミュレーションする際のテストケース生成の自動生成 (用参考文献追加) や Barltrop らの宇宙機のシステムテストの自動化を実現する研究 [14] などが

ある。

3. 提案分類方法

本章では、分析の目的及び本研究での分類方法について説明する。

3.1. 分析目的

ここでは宇宙機ソフトウェアを開発する過程で発生した不具合について分類することにより、効率的なソフトウェア手法を明らかにすることを目的としている。開発者は本研究の結果を考慮した上でソフトウェアテストを行うことで、効率的にソフトウェアの不具合を発見することが可能になると考えられる。本研究ではその分析結果を元に自動テストケース生成の指針とした。そのためには不具合の分析方法をテストとの関連を明確化できるようなものにする必要がある。

3.2. 予備実験

まず、着眼点として ODC および IEEE 1044-2009 を用いることを検討した。また、不具合分析に関する先行研究は全て ODC であったが、IEEE の規格に関しても適用が必要であると考え、姿勢制御系 (AOCS: Attitude and Orbit Control System) のソフトウェア不具合 10 件に対して適用を行った。なお、ODC の分類で利用したのは宇宙機ソフトウェアに対応した [20] であり、IEEE 1044-2009 は規格に準じて行った。その結果、先行研究の改良型 ODC に存在していた属性の項目のほとんどは使われることはなかった。理由としては運用フェーズにターゲットを絞ったものであり、ソフトウェア開発にはうまく適合できなかったことが挙げられる。また、対象としているのが、宇宙機ソフトウェア自体なので Target は分類する必要がなかった。一方で IEEE 1044-2009 の方は半分の属性が” Unknown” であったものの、” Effect” や” Mode” などは欠陥の特徴を大きくとらえて有効に分けられるものも存在し、いくつかの属性は ODC と重複していながらも、項目自体は ODC よりも適切に分類できているものも存在した。添付資料にその結果を示す。

3.3. 分類

上記の結果により、表 4 の ODC を改良したソフトウェア分類方法を構築した。まず、先行研究 [20] をソフトウェア検証のための戦略抽出のために変化させた点としては、運用に関する欠陥分類を削除し、IEEE の属性である Mode 及び Effect を組み込んだことにある。次に ODCv5.2 を組み込んだことにある。これは前述のとおりソフトウェアのコーディングと設計における欠陥について詳細を記述したものである。これを利用することにより、AOCS に関しても不具合を洗い出すことができる考えた。また、テストフェースと不具合の特徴を関連付けるために [1] で提案されているようにテストを行った段階を項目として追加した。また、属性 Detection Activity の要素である Supplier Testing は Unit・Function Test、System Test、Integration Test、Other に細分化した。

表 4: テスト改善のための欠陥分類の属性

タイミング	属性	意味
欠陥報告時	Insertion Activity	開発のどの段階で不具合が混入したのか
	Detection Activity	開発のどの段階で不具合が発見されたのか
	Effect	不具合が与える影響
	Trigger	どのような状況で発生したか
欠陥修正時	Type	何を間違ったのか
	Mode	機能が抜けていたのか、間違った振舞いになっていたのか

表 5: テスト改善のための欠陥分類の要素

Insertion Activity	Detection Activity	Effect	Trigger	Type	Mode
Requirement Design Coding Unknown	Design Review Coding IV&V Customer Testing Production Unknown Supplier Testing	Functionality Performance	Design Conformance Logic/Flow Lateral Compatibility Rare Situation Workload/Stress Blocked Test Test Coverage Software Configuration Hardware Configuration Simple Path Normal Activity Complex Path	Function/Algorithm Interface Assignment/Initialization Timing	Missing Wrong

4. 分類結果

この章では実際の宇宙機プロジェクト計 5 個 50 個の不具合に対して分析を行った結果を示す。また、Deep Dive と呼ばれる属性同士を掛け合わせて関連性を調べる手法を用いることによって宇宙機ソフトウェア開発が抱える問題について明らかにする。

4.1. Insertion Activity

図 1 はソフトウェア開発工程のどこで欠陥が混入したかという属性である Insertion Activity の分布である。Design に起因する不具合が最も多く 33 個 (66%) 存在した。また、ここでの Unknown は分類不能というものが 5 つ存在するが、これは Design または Coding で混入したことはわかるが、不具合報告表からはどちらなのか判別できなかったものである。そのため、Coding 及び Design の個数が多くなることが考えられる。いずれにしろ、通常のソフトウェア開発と同様に設計段階で不具合が混入することが多いことがわかる。

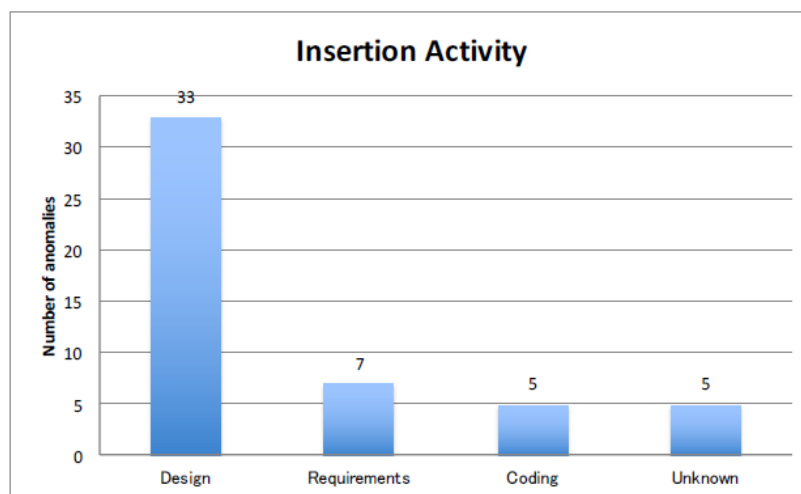


図 1: Insertion Activity の分布

4.2. Detection Activity

図 2 はソフトウェア開発のどのフェーズで不具合が見つかったかという属性の Detection Activity の分布である。本研究で対象とするデータが開発しているメーカーより提供を受けたものであるため、ほとんどは Supplier Testing 見つかっている (45 件 or 90%)。一方で、JAXA で実施するソフトウェアの独立検証と有効性確認 (IV&V) でも 3 件 (6%) の不具合が発見されていることから有効性が確認される。また Production に分類された 1 件 (2%) は JAXA での通電試験まで不具合が発見されなかった例である。これは試験が最終段階まで抜けてしまったことに起因する。また、Design Review で見つかった 1 件 (2%) は複数ドキュメントの整合性が取れていなかったことで発見された不具合である。

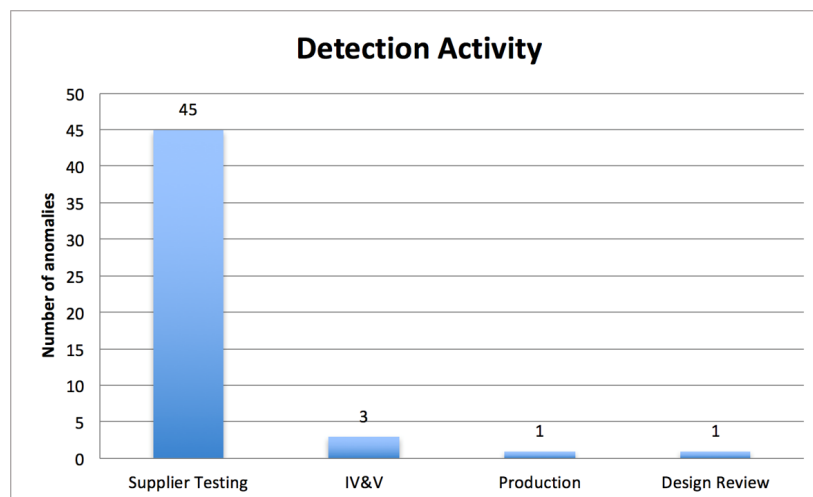


図 2: Detection Activity の分布

4.2.1. Supplier Testing

図3はソフトウェアテストのフェーズ別で不具合を分類した、Supplier Testing の分布である。これは元々特徴としてはシステムテストにおいて最も多くの不具合が存在していることにある。通常のソフトウェア開発プロセスでは unit・function テストで多く発生するが [7]、今回の不具合分類では unit・function テストが多く発生していることに特徴がある。なお、ここで言われている unit・function テストは CSCI(Computer Software Configuration Item) と呼ばれるもので分類されており、これは通常のインテグレーションテストのようなものであることに注意したい。この場合のシステムテストはコンポーネント同士のつながりではなく、大きなシステム同士の結合である (e.g. ground system - spacecraft) したがって、この2つの事象に対して対策を行うことが重要であることがわかる。

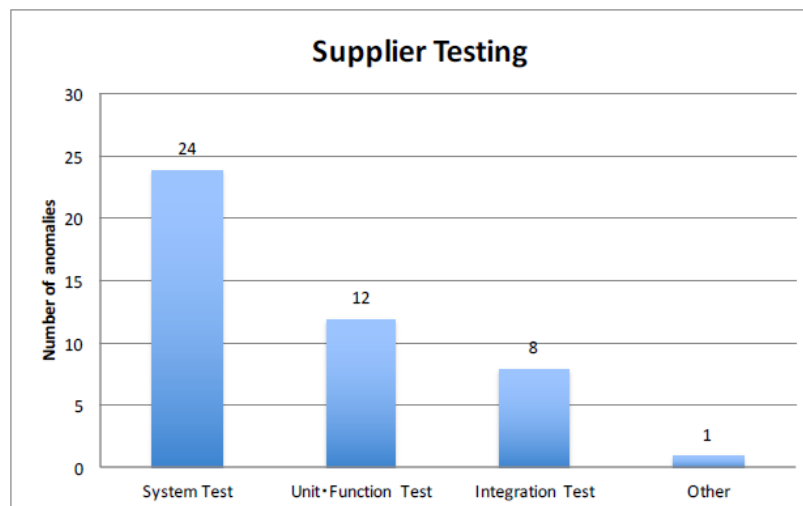


図 3: Supplier Testing の分布

4.3. Effect

図 4 は発生した不具合がシステムに与える影響の属性である Effect の分布である。Effect は Functionally と Performance に分けることができる。Functionally は機能の実装忘れなど機能が抜けているまたは要求されていない機能が実装されているなどがある。また、Performance は要求される Performance を出せないこと (e.g., capacity, computational accuracy, response time, throughput, or availability) ことによる不具合である。今回の分類では Functionality が 35 個 (70%) 存在し、Performance が 15 個 (30%) 存在した。

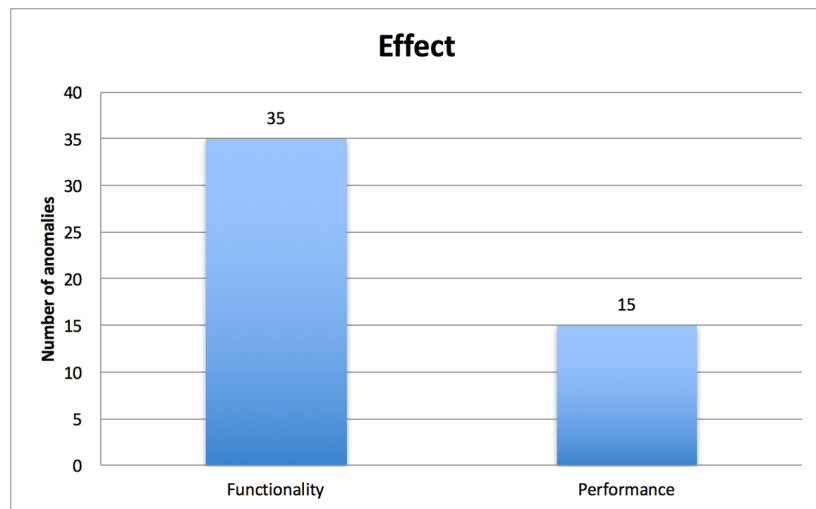


図 4: Effect の分布

4.4. Trigger

図 5 は欠陥が発生した要因の属性である Trigger の分布である。これからもわかるように、開発工程やシステムの矛盾によって発生する不具合である Design Conformance が約 20% を占め、大きな問題となっていることがわかる。

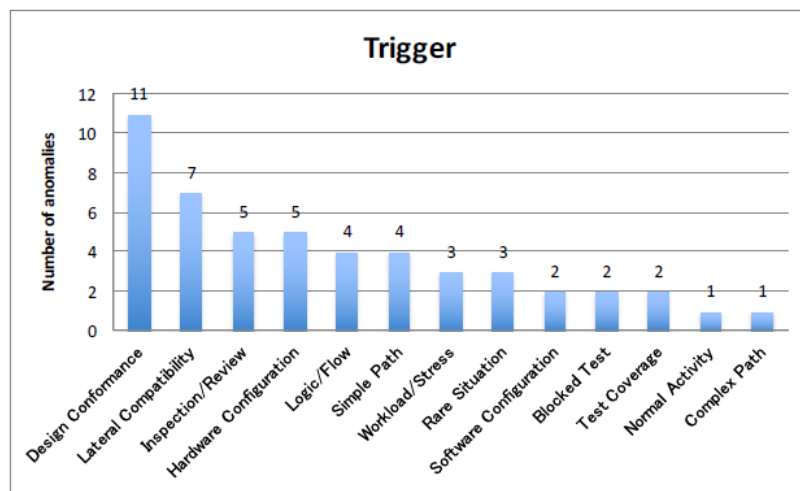


図 5: Trigger の分布

表 6: Trigger の定義

要素	定義
Design Conformance	設計とコードなど前後の開発での問題の混入
Lateral Compatibility	単純なシステム間の矛盾等
Inspection/Review	Inspection や Review の行程に問題があったことに起因する不具合
Hardware configuration	特定のハードウェア条件においてソフトウェアが期待通りに動作しない不具合
Logic/Flow	言語知識から理論・データに矛盾が生じることによって発生する不具合
Simple Path	ホワイトボックステストで発生した不具合
Workload/Stress	システムを限界条件付近で使用した時に発生した不具合
Rare Situation	想定外または言及されていないシステムの振る舞いによって生成されるソフトウェアの不具合
Software Configuration	特定のソフトウェアの設定下で動作しない不具合
Blocked Test	何らかの原因でテストが実行できなかったことに起因する不具合
Test Coverage	ブラックボックステストで一つの機能をパラメータまたは単一のパラメータでの呼出時に発生する不具合
Complex Path	ホワイトボックステストで幾つかの分岐やテスト条件が重なった時に見つかる不具合

表 7: Trigger の実例

要素	実例
Design Conformance	設計基準を元に設計書が書かれていなかったことによる仕様もれ
Lateral Compatibility	非同期と同期でのシステムの矛盾
Inspection/Review	A and B の時の異常停止が定義されていない
Hardware configuration	EEPROM の書き込み制限がなされていない
Logic/Flow	制御コマンドシーケンスの誤り
Simple Path	大域変数の扱い間違い
Workload/Stress	不可試験によるロールオーバー時の不具合の負荷試験による発見
Rare Situation	オフノミナルに対しての考慮不足
Software Configuration	信号への設計マージンの考慮不足
Blocked Test	割り込み処理有効、無効化のタイミングの検証を実機が無かったことによる検証不足に起因する不具合
Test Coverage	算術アルゴリズムの誤り
Complex Path	タイミング設計がうまくいっていないことに起因して、用いる変数の誤り

ここで、前述のソフトウェアの不具合が機能的なものなのかパフォーマンス的なものなのかの属性である Effect を用いて Deep Dive で分析を行う。この 2 つの属性で分析することによって要因となった不具合が機能的なものなのかパフォーマンス的なものなのかを見ることができる。実際に分析を行った結果が図 6 である。顕著に表れている結果として、ホワイトボックステストで発生した不具合である Simple Path、Inspection や Review の不備が不具合の原因となる Inspection/Review、単純なシステム間の矛盾である Lateral Compatibility は Function の問題が多いことがわかる。一方で Hardware Configuration に関しては Performance の不具合のみである。これは Hardware にある特定の値を与えるとパフォーマンスが下がることが多く、それをソフトウェア側で設定できていないことに起因する。

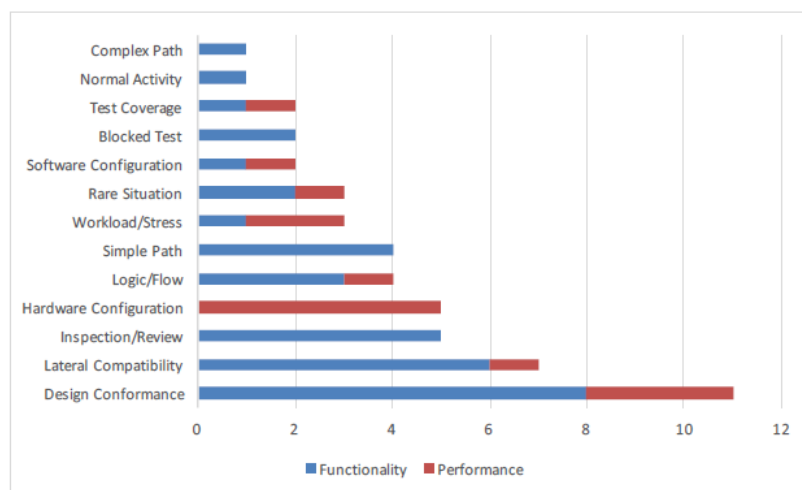


図 6: Trigger-Effect の分布

4.5. Type

図7は修正した欠陥の種類の属性である Type の分布である。最も多いのは機能またはアルゴリズムの修正を行ったときに分類をされる Function/Algorithm となっている。しかしながら、データの到着タイミングや同期の問題で発生する Timing, 値の割り当て、初期化の問題である Assignment/Initialization, S/W 間 (例えばモジュール)、H/W-S/W 間の問題も Interface との差は小さく、ほぼ同じぐらいであると言えるだろう。一方で Documentation の修正がないのは、開発段階のエラーがほとんどであり、文書の修正よりも機能の修正に力を入れたからであると考えられる。

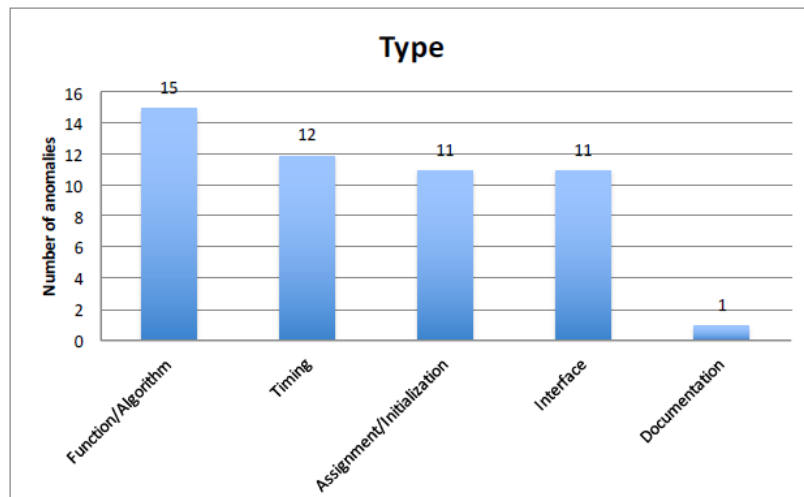


図 7: Type の分布

ここで、Type と前述のソフトウェアの不具合の原因である Trigger に関して Deep Dive で分析を行った結果を表 8 に示す。特徴的な点としてまず、不具合修正項目である Timing 及び Function/Algorithm が Trigger によらず比較的分散している点にある。また、最も多い不具合としては Interface が修正箇所でない不具合原因が単純なシステム間の矛盾等である Lateral Compatibility である。これは、不具合箇所と不具合修正箇所が一致しているためこのようになったことが考えられる。

表 8: Trigger-Type の分布

Trigger	Type					
	Func/Alg	Timing	Ass/Init	Interface	Doc	Total
Des Conf	3	2	4	1	1	11
Late Comp	0	0	1	6	0	7
Ins/Rev	2	0	2	1	0	5
HW Conf	0	2	1	2	0	5
Logic/Flow	2	1	1	0	0	4
Simple Path	2	1	0	1	0	4
Work/Str	1	1	1	0	0	3
Rare Situ	2	1	0	0	0	3
SW conf	1	1	0	0	0	2
Blo Test	0	2	0	0	0	2
Test Cov	1	1	0	0	0	2
Nor Act	1	0	0	0	0	1
Comp Path	0	0	1	0	0	1
Total	15	12	11	11	1	50

また、Type と前述のソフトウェアの不具合が発見されたテスト段階の属性である Supplier Testing を用いて、修正された欠陥との関係を Deep Dive で分析した結果を図 8 に示す。なお、比較の為に IV&V も表に挿入している。最も多いのは Timing に関する修正が System Test で発見される場合である。Unit・Function Test ではほとんど発見することはできていない点に問題が存在する。また一方で、Timing、Assignment/Initialization の修正に関する不具合は Unit・Function Test と System Test で個数の違いがあまりないことから十分なテストができていないと考えられる。

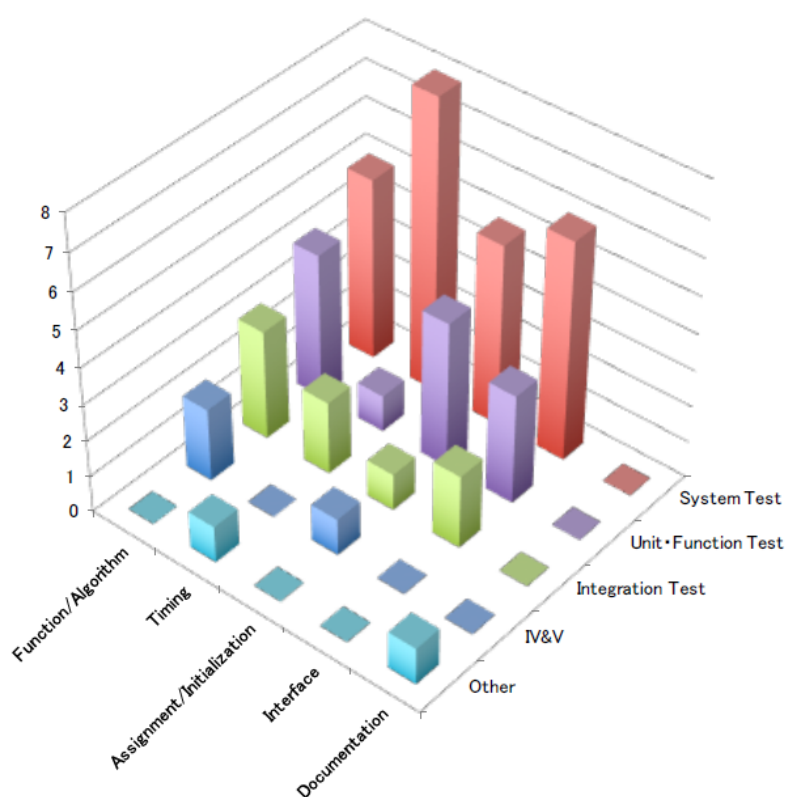


図 8: Type-Supplier Testing の分布

4.6. Mode

Mode は発生した不具合が間違っただけのふりまをするようになっていた (Wrong) のかそれとも機能が抜けていた (Missing) のかを表す属性である。Mode の分布を図 9 に示す。それぞれ Wrong が 29 個 (20%)、Missing が 20 個 (14%)、分類ができなかった Extra が 1 個 (1%) 存在した。

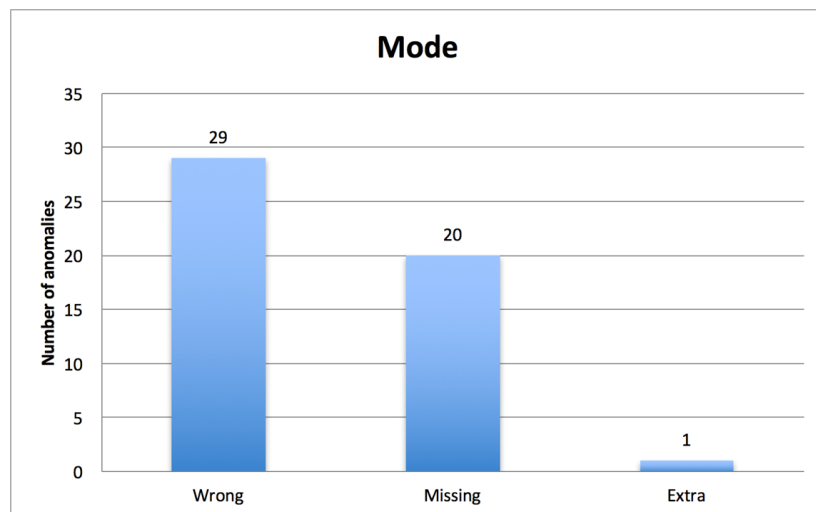


図 9: Mode の分布

ここで、Mode と前述のソフトウェア不具合が発見された Trigger を用いて、Deep Dive で分析した結果を図 10 に示す。大きな特徴としては設計とコードの間など前後の開発で不具合が生じたことを表す属性である Design Conformance では機能が抜ける Missing が多いのに対して、単純なシステム間の矛盾を表す Lateral Conformance や特定のハードウェア条件においてソフトウェアが期待通りに動作しない不具合である Hardware Configuration では Wrong が多い。Design Conformance であれば機能自体は実装されているが、要求や設計の不具合により機能が誤って実装されていたことが考えられる。一方で Hardware Configuration であれば、特定の値によって不具合が発生することが主な要因となっているため、機能自体は存在しているが、エラー処理や SW/HW 間のインターフェースの問題によって不具合が発生していることが考えられる。

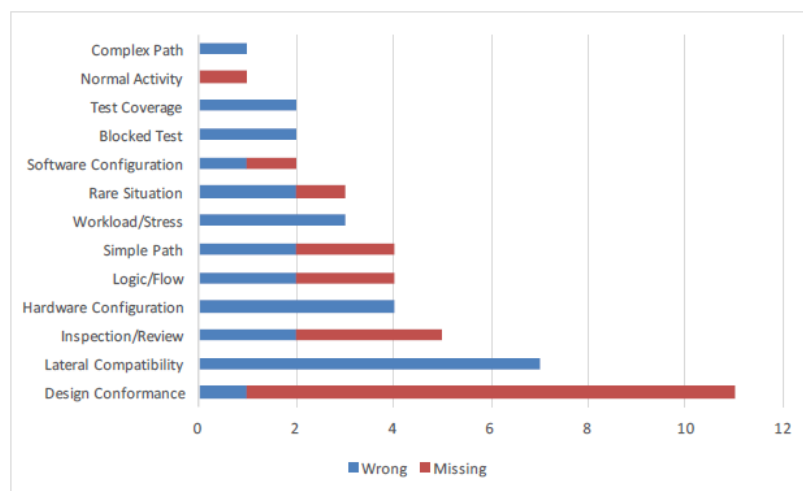


図 10: Mode-Trigger の分布

4.7. 考察及び課題

5. 提案手法

本章では前章の結果に基づき、自動単体テストケース生成によって問題解決を行った結果を示す。以降では **Concolic Testing** の宇宙機ソフトウェアへの適用のアプローチ、対象とした宇宙機ソフトウェアの概要、適用結果及びその考察、問題点に関して述べる。

5.1. **Concolic Testing** の宇宙機ソフトウェアへの適用

5.1.1. 対象宇宙機ソフトウェア

本研究では実験対象ソフトウェアとして小型実証衛星 4 型 (SDS-4: Small Demonstration Satellite 4) の姿勢軌道制御系 (ACFS: Attitude and Flight Control System) 搭載ソフトウェアを選択した [35]。この衛星は機器や部品などの新規技術を事前に宇宙で実証し、成熟度の高い技術を利用衛星や科学衛星に提供することを目的としている。小型であることから、大型衛星にくらべて様々な実験をタイムリーに進めることができる。また、メーカーによって作られるのではなく、人材育成の観点より設計から運用までの一連業務を JAXA 職員によって行われることに特徴がある。特に今回対象とした ACFS は衛星の姿勢を決定やアクチュエータの制御を行う衛星の基本的な機能を担うものである。

5.1.2. 適用結果

実際にプログラム中の条件文 (if 文、switch 文) 計 1600 行に対して調査及び Concolic Testing の実効を行った結果、以下の表 9 の 4 つのパターンが実行不可能な条件文として抽出された。

表 9: Concolic Testing 適用結果

パターン	コード例	行数 (条件文数)
配列の添え字が変数	<code>(p_acsf_input->gumd[i].f.update)</code>	98
ビット演算	<code>(data_buf_u » 20) & 0x01) != 1</code>	65
ポインタ変数	<code>* mode == * pre_mod</code>	11
unsigned long 型	<code>int prg_ret(unsigned long a){switch(a){</code>	2

5.1.3. 考察及び解決策

5.2. ループ展開

6. 評価実験

6.1. 実験目的と内容

6.2. 評価結果

6.3. 考察

7. おわりに

[5] [31] [32] [12] [25] [21] [3] [4]

謝辞

本研究を進めるにあたり、多くの方々に御指導、御協力、御支援を頂きました。ここに謝意を添えてお名前を記させていただきます。本当にありがとうございました。

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 ソフトウェア設計学研究室 飯田 元教授には、本研究の全課程において熱心な御指導を賜りました。研究方針だけではなく、研究に対する姿勢、研究者としての心構え、論文執筆、発表方法についても多くの御助言を頂きました。心より厚く御礼を申し上げます。

参考文献

- [1] CREST Concolic Test generation tool for C. <http://www.burn.im/crest/>.
- [2] CREST-z3. <https://z3.codeple.c/>.
- [3] The Yices SMT Solver. <http://yices.csl.sri.com/>.
- [4] Z3. <https://z3.codeplex.com/>.
- [5] Sasikumar Punnekkat Adnan Causevic, Daniel Sundmark. An Industrial Survey on Contemporary Aspects of Software Testing. In *Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2010)*, pp. 393–401, 2010.
- [6] Christian Denger Bernd Freimut and Markus Ketterer. An Industrial Case Study of Implementing and Validating Defect Classification for Process Improvement and Quality Management. In *Proceedings of 11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS'05)*, pp. 10–19, 2005.
- [7] Aaron J. Shenhar [Brian J. Sauser, Richard R. Reilly. Why projects fail? how contingency theory can provide new insights – a comparative analysis of nasa’s mars climate orbiter loss. *International Journal of Project Management*, Vol. 27, No. 7, p. 665–679, 2009.
- [8] Ram Chillarege. Using ODC to diagnose an Agile Enterprise Application Development. In *Proceedings of the 24th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2013)*, p. 45, 2013.
- [9] Lee Copeland. *A Practitioner’s Guide to Software Test Design*.
- [10] Rick D. Craig and Stefan P. Jaskiel. *Systematic Software Testing*. Artech House, 2002.
- [11] IBM. *Orthogonal Defect Classification v 5.2 for Software Design and Code*. , 2013.
- [12] Koushik Sen Jacob Burnim. Heuristics for Scalable Dynamic Test Generation. In *Proceedings of the 2008 23rd IEEE/ACM International Conference on Automated*

- Software Engineering (ASE'08)*, pp. 443–446, 2008.
- [13] John J. Chilenski Leanna K. Rierson Kelly J. Hayhurst, Dan S. Veerhusen. *A practical Tutorial on modified condition/decision coverage*. National Aeronautics and Space Administration, 2001.
 - [14] Kenneth H. Friberg Kevin J. Barltrop and Gregory A. Horvath. Automated Generation and Assessment of Autonomous Systems Test Cases. In *Proceedings of IEEE Aerospace Conference (AeroConf 2008)*, pp. 1–8, 2008.
 - [15] Nancy G. Leveson. *Safeware: System Safety and Computers*. Addison-Wesley Professional, 1995.
 - [16] [R.O. Lewis. *Independent verification and validation: A life cycle engineering process for quality software*. Wiley, 1992.
 - [17] Isaac Persing Ruili Geng Xu Bai LiGuo Huang, Vincent Ng and Jeff Tian. AutoODC: Automated Generation of Orthogonal Defect Classifications. In *Proceedings of 30st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2015)*, pp. 412–415, 2015.
 - [18] J.L. Lions. *Ariane 5 flight 501 failure*. European Space Agency(ESA), 1996.
 - [19] Robyn R. Lutz and Ines Carmen Mikulsk. Requirements Discovery During the Testing of Safety-Critical Software. In *Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering (ICSE '03)*, pp. 578–583, 2003.
 - [20] Robyn R. Lutz and Ines Carmen Mikulsk. Empirical analysis of safety-critical anomalies during operations. *IEEE Transaction on Software Engineering*, Vol. 30, No. 3, pp. 172–180, 2004.
 - [21] Giovanni Denaro Mauro Pezz'e Mauro Baluda, Pietro Braione. Enhancing structural software coverage by incrementally computing branch executability. *Software Quality Journal*, Vol. 19, No. 4, pp. 725–751, 2011.
 - [22] Phil McMinn. Search-based software test data generation: A survey. *Software Testing, Verification and Reliability*, Vol. 14, No. 2, pp. 105–156, 2004.
 - [23] Kishor S. Trivedi Micheal Grotte, Allen P. Nikora. An Empirical Investigation of Fault Types in Space Mission System Software. In *Proceedings of the 40th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN*

- 2010), pp. 447–456, 2010.
- [24] Yoonkyu Jang Moonzoo Kim, Yunho Kim. Industrial Application of Concolic Testing on Embedded Software: Case Studies. In *Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2012)*, pp. 390–399, 2012.
 - [25] Jonathan de Halleux Nikolai Tillmann. Pex—White Box Test Generation for .NET. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Tests and Proofs (TAP 2008)*, pp. 134–153, 2008.
 - [26] Andrea Mattavelli Mattia Vivanti Ali Muhammad Pietro Braione, Giovanni Denaro. An Industrial Case Study of the Effectiveness of Test Generators. In *Proceedings of the 7th International Workshop on Automation of Software Test (AST 2012)*, pp. 50–56, 2012.
 - [27] Jarir K. Micheal J. Chaar Halliday Diane S. Moebus Ram Chillarege, Inderpal S. Bhandari. Orthogonal defect classification—a concept for in-process measurements. *IEEE Transaction on Software Engineering*, Vol. 18, No. 11, pp. 943–956, 1992.
 - [28] Bhupendra kharpuse Durga Prasad Mohapatra Banshidhar Majhi Sangharatna Godbole, Adepu Sridhar. Generation of branch coverage test data for simulink/stateflow models using crest tool. *International Journal of Advanced Computer Research*, Vol. 3, No. 4, pp. 222–229, 2013.
 - [29] Durga Prasad Mohapatra Sangharatna Godbole. Analysis of mc/dc coverage percentage and cyclometric complexity for structured c programs. *International Journal of Computer & Mathematical Sciences*, Vol. 2, No. 2, pp. 16–20, 2014.
 - [30] IEEE Computer Society. *1044-2009 - IEEE Standard Classification for Software Anomalies.* , 2010.
 - [31] Sarfraz Khurshid Willem Visser, Corina S. Păsăreanu. Test input generation with java PathFinder. In *Proceedings of the 2004 ACM SIGSOFT international symposium on Software testing and analysis (ISSTA '04)*, pp. 97–107, 2004.
 - [32] Keijo Heljanko Xiang Gan, Jori Dubrovin. A symbolic model checking ap-

proach to verifying satellite onboard software. *Science of Computer Programming*, Vol. 82, pp. 44–55, 2014.

- [33] Brian Robinson Xiao Qu. A Case Study of Concolic Testing Tools and their Limitations. In *Proceedings of the 8th ACM international conference on Embedded software (EMSOFT'11)*, pp. 117–125, 2011.
- [34] 梅村晃広. S A T ソルバ・S M T ソルバの技術と応用. コンピュータソフトウェア, Vol. 27, No. 3, pp. 24–35, 2010.
- [35] 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構. 小型実証衛星 4 型「SDS-4」. http://www.jaxa.jp/projects/sat/sds4/index_j.html.